

{joomplu:1509}С 29 по 30 июня 2017 г. сотрудники НОЦ «Стойкость» (НИЯУ МИФИ и АО «ЭНПО СПЭЛС») приняли участие в Международной Евразийской конференции по энергетике и Международной IEEE-Сибирской конференции по управлению и связи (SIBCON - 2017), приуроченных к международной выставке ASTANA EXPO-2017, прошедших на базе Сибирского федерального университета в г. Астане, Казахстан.

Конференция собрала более 100 участников из 10 стран дальнего и ближнего зарубежья (США, Германия, Польша, Египет, Иран, Сирия, Россия, Беларусь, Украина, Казахстан). Столь масштабное мероприятие в области энергетике и связи проводилось в КазАТУ впервые.

{joomplu:1508}{joomplu:1511}{joomplu:1512}

Работа конференции проходила в рамках секций по направлениям: фундаментальные проблемы теории управления и связи, энергосбережение и энергетика будущего, компьютерные измерительные технологии, датчики и системы.

От НОЦ «Стойкость» были представлены следующие 5 публикаций:

- 1. Maksim E. Cherniak, Alexander.A.Pechenkin, Roman K. Mozhaev, Anastasia V. Ulanova, Alexander Y. Nikiforov** *Automated measurement system for optoelectronic devices based on National Instruments PXI-platform*
- 2. I.I. Shvetsov-Shilovskiy, A.B. Boruzdina, A.V. Ulanova, A.A. Orlov, K.M. Amburkin, A.Y. Nikiforov** *Measurement System for Test Memory Cells Based on Keysight B1500A Semiconductor Device Analyzer Running Labview Software*
- 3. L.N. Kessarinskiy, G.G. Davydov, D.V. Boychenko, A.S. Artamonov, A.Y. Nikiforov, I.B. Yashanin** *X-Ray Grading Procedure for Conventional 65-nm CMOS Technology*

4. **N.S. Diatlov, P.K. Skorobogatov, K.A. Epifantsev** *The optimal EOS amplitude increment at electric strength tests of electronics*

5. **A.E. Rudenkov, A.O. Akhmetov, D.V. Bobrovsky, A. I. Chumakov, A.N.Shepanov** *Automated Measuring System for MIL-STD-1553 Integrated Circuits Functional and Parametric Control*